BL23SU 原研 重元素科学

1.はじめに

BL23SUは軟×線の分光実験や照射実験を目的に建設され た原研専用軟×線ビームラインである。ビームラインは蓄 積リング棟とRI実験棟のセクションに分かれており、前者 には表面化学ステーションと生物ステーション、後者には 電子物性ステーションとしての高分解能光電子分光装置と 軟×線吸収磁気円二色性分光装置が設置されている。2002 年度にはRI実験棟における国際規制物資の取扱い環境が整 備され、ウラン化合物を対象とする原研独自の研究を開始 した。また、ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの一 環として、表面化学ステーションに高速原子分子ビーム装 置、超音速配向分子ビーム装置、および原子分子ビーム装 置、超音速配向分子ビーム装置、および原子分子ビーム装 置を導入し、電子物性ステーションにレーザーMBE装 置を導入した。2003年度はこれらの研究環境を最大限に活 かした原研独自研究と外部ユーザー支援研究を加速化させ る予定である。

(村松 康司、馬場 祐治)

2.軟X線ビームラインBL23SU用挿入光源

SPring-8の軌道安定化プロジェクトの活動の中で、ID23 の位相駆動開始と停止時の軌道変動が問題になった。この 軌道変動は、

- ・位相駆動用サーボモーターの電磁ブレーキを解除(=サ ーボモーターの電源をON)した時に跳びが出る。
- 一度位相を駆動してサーボモーターのローカルフィード バックで位置を保持している間、定周期の軌道変動が表 れる。
- ・定周期の振動は電磁ブレーキをかけると消える。
- ・位相を止める位置に応じて周期が変化する。

という特徴があった。

サーボモーターからの漏れ磁場を磁場測定したところ、 漏れ磁場の変動パターンと軌道変動のパターンが大変良い 相関を示したので、この軌道変動の原因はモーターからの 漏れ磁場であることが解った。2002年夏の長期停止期間に 工事を行い、サーボモーター本体に磁場遮蔽体を取り付け た。工事後、漏れ磁場の遮蔽を磁場測定で確認して、スタ ディで軌道変動を測定したところ、遮蔽前は、蓄積リング の電子ビームモニターで5µm程度あった軌道変動はほと んど観測不可能になった。

(中谷健、安居院あかね、吉越章隆)

3.半導体および金属表面の化学反応ダイナミクス(表面 化学ステーション)

表面化学ステーションでは、半導体および金属表面で起 こる化学反応のメカニズムが研究されている。特に酸化や 窒化反応における、(1)表面の化学組成や化学結合状態の 実時間その場観察、(2)入射酸素分子の運動エネルギーを パラメータとした表面反応ダイナミクス、を主な実験テー マとしている[12]。実験手段として、超音速分子ビーム法と 放射光光電子分光法を用いている。超音速分子ビームと放 射光を同時にサンプルに照射しながら光電子分光観察がで きる世界的にも特色ある表面反応分析装置を開発した。 2002年度ではSi(001)、Si(111)、Ti(0001)、Cu(001)、 Cu(111)単結晶表面の酸化および窒化初期過程の解明を 進めた。Si(001)表面のO2分子による高温酸化においては、 酸化膜厚と膜質は表面温度で決定されるとの予想に反し て、O2分子の運動エネルギーによって酸素の吸着曲線が 全く異なることが明らかとなった。表面温度:945K、運 動エネルギー:0.8eVの時には表面に酸化膜は形成されず にSiO分子が熱脱離する。1.2eVではSiO脱離と酸化膜形成 が共存することによる緩やかな吸着曲線を示し、1.5eV以 上ではラングミュア型に近い急峻な吸着曲線を示した。こ れは、表面温度とガス圧力に加えて、運動エネルギーが第 三の反応制御パラメータになることを表している。さらに、 大学や国立研究所と共同でTi(0001) Cu(001) Cu(111)



図1 Ti(0001)表面とO2ガスとの化学反応でTi(0001)表 面が金属Tiから、TiO2に変化する様子を表すリアル タイム光電子スペクトルとLEED像。

実験ステーション(原研ビームライン)

Si(111)表面のO²分子ビームによる酸化素過程の研究を推進し、運動エネルギーで誘起される反応過程がこれらの表面でも存在することを明らかにした。また、Ti(0001)表面の窒化素過程の実時間その場光電子分光観察も実現した。図1にTi(0001)表面の酸化過程のリアルタイム光電子分光^[3]と低エネルギー電子線回折像の例を示す。これらの極薄絶縁膜の形成過程に関する基礎的知見は、純粋表面化学の発展に寄与するのみならず、次世代真空材料やLSI配線材料の不働態化、高誘電率薄膜の開発等のナノテクノロジーに関わる研究発展を基礎から支援するものとなっている。

(寺岡 有殿、吉越 章隆)



チミジンモノフォスフェイト

図2 デオキシリボース及びチミン系列の分子の構造。

4. DNA損傷の軟X線光化学過程(生物ステーション)

生物ステーションは、突然変異や発ガンなどの直接の原 因といわれているDNAの損傷過程を、軟X線領域のアン ジュレータ光を使って分光学的に研究するためのステーシ ョンである。現在、電子常磁性共鳴(EPR)装置と四重極 質量分析装置(QMS)のふたつの実験装置による実験が 開始されており、DNAの軟X線領域における損傷過程に ついていくつかの重要な知見が得られている^[47]。

特にQMSを用いて、酸素1s *共鳴励起エネルギ ーでの脱離イオンの測定がデオキシリボース及びチミン系 列の分子(チミン、デオキシチミジン及びチミジンモノフ ォスフェイト(図2))の薄膜試料を用いて行われ、それぞ れ特徴のある脱離イオンスペクトルが得られた(図3)。こ れらのスペクトルの比較から、デオキシリボースは他の分 子に比べて2倍以上壊れやすいことが明らかになった。こ れは、ペントース環の捩れた構造に起因する内部エネルギ ーが、不飽和結合を持つチミンのピリミジン環に比べて高 いことによると推測される。また、デオキシチミジン及び チミジンモノフォスフェイトのイオンスペクトルは、デオ



図3 酸素 1 s * 共鳴励起エネルギーでの 脱離イオンスペクトル。

キシリボースのそれとよく似ていることから、これらの分 子でもペントース部位が壊れやすいことが示唆された。デ オキシリボースからの脱離フラグメントの種類から、C-C 結合とC-O(または別のC-C結合)の同時的な切断が起こ っていることが推測される。これはDNA分子中では、ペ ントース環の完全な欠落を伴う - タイプのssb(1本 鎖切断)が生じる可能性を示している。以上のことから、 軟X線によるDNA損傷の過程の中で、デオキシリボース の崩壊が最も起きやすい損傷のタイプとして、デオキシリ ボースの崩壊による1本鎖切断タイプの損傷が示された。 今後は、このような損傷と近接して生じる酸化的塩基損傷 の組み合わせからなるクラスターDNA損傷の解析を進め て行くと同時に、同じエネルギー領域の電子線インパクト による脱離イオン測定も行い、フォトンと電子の比較を行 う予定である。

(藤井 健太郎、横谷 明徳)

5.強相関電子系機能材料の電子状態研究(電子物性ステ ーション)

超伝導や巨大磁気抵抗など特異な物性を示す強相関電子 系機能材料の電子状態を解明するため、これらの高分解能 光電子分光実験と軟X線吸収磁気円二色性分光実験を行っ た^[8-13]。特に、RI実験棟における国際規制物資の取扱い環



図4 ウラン化合物UTGas(T=Fe、Pt)の価電子帯スペクトル(左)とフェルミ準位付近(右)のスペクトル。

境を整備してウラン化合物の光電子分光実験を実現した。 さらに、ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの一貫と してレーザーMBE装置を導入し、ナノ構造薄膜研究を開 始した。

(1) 高分解能光電子分光実験

ウラン化合物UTGas(T=Fe、Pt)は重い電子系超伝導
 体であるCelrInsやCeCoInsと同じHoCuGas型構造を持ち、
 準二次元的な電子状態を持つと考えられている。このうち、



図5 SrFe1-xCoxO3におけるCoサイトの磁化変化。

UFeGasは常磁性体であり、UPtGasはTN=26Kの反強磁性 体である。そこで、これらの電子状態を解明するため、 UTGasの放射光光電子分光実験を行った。図4に価電子帯 スペクトルと、フェルミ準位近傍を詳細に測定したスペク トルを示す。フェルミ準位近傍に観測されるスペクトル構 造はU5f電子状態を反映し、この電子状態がFeとPtの系で 異なることが示唆された。現在、この解析を進めている。 (2)軟X線吸収磁気円二色性分光実験

特異な反強磁性 - 強磁性転移現象を示すSrFe1-xCoxO3 (0<x<0.5)の電子状態を解明するため、組成比x=0.2の転 移点前後におけるFeとCoの磁気的変化を軟X線吸収磁気 円二色性分光法により調べた。その結果、x<0.2の領域で はFeとCoの磁化はxの増加に伴って単調に増加するが、 x>0.2の領域では、ほぼ一定の磁化を示すFeに対して、Co では図5に示すように磁化の増減が明瞭に観測された。こ れから、Coのスピン配置はx>0.2の強磁性転移後に大きく 変化することが示唆された。

(岡根 哲夫、岡本 淳)

参考文献

- [1] Y. Teraoka and A. Yoshigoe : Jpn. J. Appl. Phys. 41
 (2002) 4253-4260.
- [2] A. Yoshigoe and Y. Teraoka : Surface and Interface Analysis 34 (2002) 432-436.
- [3] Y. Takakuwa, S. Ishidzuka, A. Yoshigoe, Y. Teraoka,
 Y. Mizuno, H. Tonda, and T. Homma : Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. B 200 (2003) 376-381.
- [4] K. Fujii, K Akamatsu, Y. Muramatsu, and A. Yokoya : Nucl. Instru. and Meth. B 199 (2003) 249-254.

実験ステーション(原研ビームライン)

- [5] K. Akamatsu, K. Fujii, and A. Yokoya : Nucl. Instru. and Meth. B 199 (2003) 328-331.
- [6] A. Yokoya, K. Akamatsu, and K. Fujii Nucl. Instru. and Meth. B 199 (2003) 366-369.
- [7] K. Fujii, K. Akamatsu and A. Yokoya : Surf. Sci. 528 (2003) 249-254.
- [8] A. Agui, Y. Saitoh, A. Yoshigoe, T. Nakatani, T. Matsushita and M. Mizumaki : Surf. Rev. Lett. 9 (2002) 843-848.
- [9] S. -I. Fujimori, A. Ino, T. Okane, A. Fujimori, K. Okada, T. Manabe, M. Yamashita, H. Kishida and H. Okamoto : Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 247601.
- [10] S. -I. Fujimori, A. Ino, T. Okane, A. Fujimori, H. Harima, D. Aoki, Y. Tokiwa, S. Ikeda, H. Shishido, Y. Haga and Y. Onuki : Physica B 312-313 (2002) 132.
- [11] S. -I. Fujimori, A. Ino, T. Okane, A. Fujimori, K. Okada, T. Manabe, M. Yamashita, H. Kishida and H. Okamoto : Surf. Rev. Lett. 9 (2002) 1065-1069.
- [12] T. Okane, S.-I. Fujimori, A. Ino, A. Fujimori, S. K. Shar, C. Mitra, P. Manfrinetti, A. Palenzona and O. Sakai : Phys. Rev. B 65 (2002) 125102.
- [13] T. Okane, S. -I. Fujimori, A. Ino, A. Fujimori, S. K. Dhar, C. Mitra, P. Manfrinetti, and A. Palenzona : Physica B, Condensed Matter **312-313** (2002) 349-351.

日本原子力研究所 関西研究所 表面化学研究グループ 寺岡 有殿、吉越 章隆 藤井 健太郎、横谷 明徳 電子物性研究グループ 安居院 あかね、岡根 哲夫 岡本 淳、斉藤 祐児 中谷 健、藤森 淳 藤森 伸一、間宮 一敏 村松 康司